

روش جدید محاسبه ظرفیت خازنی پراکنده سیم پیچ مولد تراکم شار مغناطیسی با چند حلقه مت Shank از چندین رشته سیم هادی تک لایه با چیدمان دایره‌ای تو خالی

مجید عزتی مصلح^۱، محمد رضا بسمی^{۲*}

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد برق - قدرت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد

۲- استادیار گروه برق - قدرت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد

besmi@shahed.ac.ir

(دریافت مقاله: دی ۱۳۸۸، پذیرش مقاله: آذر ۱۳۸۹)

چکیده- در این مقاله روش جدیدی به نام مدل شش ضلعی منتظم لانه زنبوری برای محاسبه ظرفیت خازنی پراکنده بین رشته سیم‌های هادی یک حلقه از سیم پیچ و بین رشته و هادی استوانه‌ای توخالی و همچنین ظرفیت خازنی کل n حلقه از سیم پیچ مولد تراکم شار مغناطیسی حلقه‌ی ارائه می‌شود. روش ارائه شده روشن تحلیلی مبتنی بر ساختار هندسی رشته سیم‌های چند لایه در درون یک حلقه از سیم پیچ مولد است. در این روش رشته سیم‌های سیم پیچ مولد به تعداد زیادی سلول المانی بسیار کوچک و مشابه تفکیک می‌شود. در این ساختار، بین دو رشته سیم هادی هم‌جوار در درون هر حلقه از سیم پیچ مولد، یک سلول بنیادی لوزی شکل با دو ناحیه ذوزنقه‌ای در نظر گرفته شده است. روش ارائه شده برای محاسبه ظرفیت خازنی پراکنده n حلقه از سیم پیچ با چندین رشته سیم هادی با سطح مقطع دایره‌ای معتبر است. رشته سیم‌های درون حلقه‌های سیم پیچ مولد به صورت کاملاً یکنواخت در چند لایه با چیدمان دایره‌ای توخالی و با فاصله‌ای معین از سطح هادی استوانه‌ای توخالی که به صورت محوری در مرکز سیم پیچ واقع شده، به دور آن پیچیده شده است. خواهیم دید که در مدت پیش روی انفجار و گسترش حجمی هادی استوانه‌ای توخالی و کاهش تعداد حلقه‌های سیم پیچ مولد تا حلقه انتهایی دوم ظرفیت خازنی پراکنده مولد افزایش یافته اما در حلقه انتهایی شاهد کاهش شدید ظرفیت خازنی پراکنده مولد خواهیم بود.

کلیدواژگان: مدل لانه زنبوری، مولد تراکم شار، خازن پراکنده، سیم پیچ حلقه‌ی ارائه شده است.

کاهش تعداد حلقه‌های سیم پیچ مولد چه تاثیری بر ظرفیت خازنی پراکنده کل مولد در طول فرایند انفجار می‌گذارد. در طراحی MCG شکل (۱) باید به مدل هندسی با دقت کافی و مشخصات اجزای هندسی مناسب برای

۱- مقدمه

در این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش هستیم که فرایند انفجار در مولد تراکم شار مغناطیسی^۱ (MCG) و در نتیجه

1. Magneto Cumulative Generator

بنابراین برای محاسبه ظرفیت خازنی کل مولد تراکم شار باید ظرفیت خازنی پراکنده‌گی موارد زیر محاسبه شود:

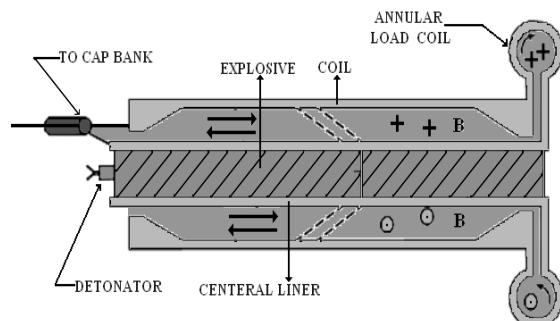
- بین رشته سیم‌های هادی یک حلقه (C_{ss}).
 - بین رشته سیم‌های یک حلقه از سیم پیچ با هادی استوانه‌ای توخالی (C_{sl}).
 - بین حلقه‌های سیم پیچ (C_{tt}).
 - بین حلقه و هادی استوانه‌ای توخالی (C_{tl}).
- در مطالعات انجام شده در زمینه مولدهای تراکم شار مغناطیسی اثر ظرفیت خازنی پراکنده‌گی^۳ حلقه‌های سیم پیچ MCG بر بررسی نشده و در اینجا برای نخستین بار این اثر خازنی در مولد MCG مطالعه می‌شود. البته مسائل مرتبط با مقاومت‌های پراکنده‌گی اهمی ac سیم پیچ‌ها، تلفات هسته، نتایج مرتبط با ظرفیت خازنی پراکنده‌گی سیم پیچ‌های مدارهای الکتریکی و الکترونیکی در ابعاد بسیار کوچک، مدارهای RF و در ترانسفورماتورهای قدرت در [۳] تا [۱۹] بررسی شده است.

ظرفیت خازنی پراکنده‌گی سیم پیچ مولد به عنوان عاملی مزاحم و ایجاد کننده تلفات به طور قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد مولد اثر می‌گذارد. هدف این مقاله ارائه روش جدیدی برای پیش‌بینی و محاسبه ظرفیت خازنی پراکنده‌گی n حلقه از سیم پیچ مولد با سطح مقطع دایره‌ای دارای k رشته سیم هادی است (شکل‌های (۲) و (۵)). روش ارائه شده در این مقاله روشی تحلیلی-هندسی است.

3. Stray Capacitance

عملکرد درست مولد دست یابیم. دستیابی به مدل مناسب هندسی، سبب افزایش دقیق در محاسبه پارامترهای مولد شده، و کارایی مولد را بالا خواهد برد [۱] و [۲].

از سوی دیگر در مولد تراکم شار مغناطیسی بدليل افزایش ولتاژ در هر حلقه در هنگام پیشروع انفجار و کاهش تعداد حلقه‌های سیم پیچ^۱، اثر میدان الکتریکی بسیار زیاد خواهد بود. میدان الکتریکی حاصل از عملیات MCG و خطوط میدان الکتریکی حاصل در بین حلقه‌های سیم پیچ و نیز بین حلقه و هادی استوانه‌ای توخالی^۲ واقع در مرکز سیم پیچ باعث ایجاد ظرفیت‌های خازنی حلقه-حلقه (C_{tt}) و حلقه-هادی استوانه‌ای توخالی (C_{tl}) می‌شود. تحلیل ارائه شده در این مقاله برای سیم پیچ‌های با سطح مقطع تکلایه‌ای با هادی رشته ای معتبر است. افزایش فرکانس در سیم پیچ MCG باعث ایجاد اثر پوستی و اثر همسایگی می‌شود که این باعث افزایش مقاومت اهمی حلقه‌های سیم پیچ می‌شود. همچنین بدليل وجود ظرفیت خازنی در سیستم، امپدانس متوجه مولد افزایش خواهد یافت.



شکل ۱ اجزای اصلی مولد حلزونی شکل (MCG) همراه با بار متصل به آن و منبع خازنی متصل شده برای تحریک اولیه

1. Coil
2. Liner

ظرفیت خازنی پراکندگی کل سیم پیچ مولد را می‌توان با
ظرفیت خازنی متوجه نقطعه‌ای متصل بین ترمیمال‌های سیم پیچ
همان‌طور که در شکل (۳) نشان داده شده مدل‌سازی کرد [۵].
در یک حلقه از سیم پیچ مولد، هم ظرفیت خازنی
رشته-رشته (C_{ss}) و هم ظرفیت خازنی رشتہ-هادی
استوانه‌ای توخالی (C_{sl}) حضور دارد.

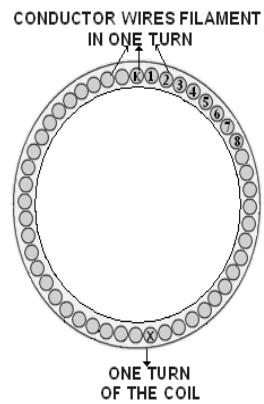
فرضها:

به منظور ترسیم جزئیات شکل (۳) فرضهای ساده‌کننده زیر
را در نظر می‌گیریم:

* فرضها برای n حلقه از سیم پیچ

(الف) از ظرفیت خازنی بین حلقه‌های ناهم‌جوار مولد
صرف نظر می‌شود.

(ب) از اثر نشستی خازنی بین لبه‌های دو حلقه سیم و
بین لبه‌های حلقه سیم و هادی استوانه‌ای توخالی مولد
صرف نظر می‌شود.



شکل ۲ سطح مقطع یک حلقه از سیم پیچ مولد تراکم شار
مغناطیسی با k رشتہ سیم هادی تکلایه

۲- الگوریتم و روش محاسبه ظرفیت خازنی

الگوریتم به شرح ذیل است:

(a) در نظر گرفتن مدلی کلی برای مدار معادل n حلقه
از سیم پیچ مولد.

(b) محاسبه ظرفیت خازنی رشتہ-رشته (C_{ss}) و
ظرفیت خازنی رشتہ-هادی استوانه‌ای توخالی (C_{sl}).

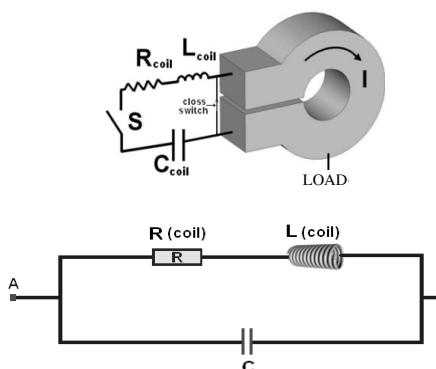
(c) محاسبه ظرفیت خازنی رشتہ حلقه-رشته حلقه
(C_{stst}) بین دو رشتہ سیم هادی از دو حلقه هم‌جوار.

(d) محاسبه ظرفیت خازنی حلقه-حلقه (C_{tt}) بین دو
حلقه هم‌جوار از سیم پیچ مولد با استفاده از نتایج بند (c).

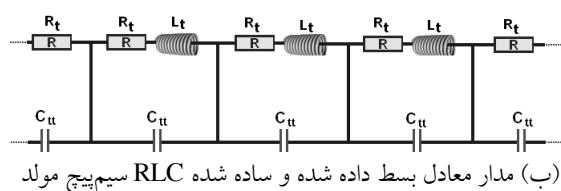
(e) محاسبه ظرفیت خازنی حلقه-هادی استوانه‌ای
توخالی (C_{tl}) بین یک حلقه و هادی استوانه‌ای توخالی با
استفاده از نتایج بند (b).

(f) محاسبه ظرفیت خازنی پراکندگی کل ($C_{(n)}$) برای
 n حلقه از سیم پیچ مولد با هادی متتشکل از k رشتہ سیم
تکلایه‌ای (با استفاده از بندهای (d) و (e)).

(g) شبیه‌سازی ظرفیت خازنی پراکندگی کل ($C_{(n)}$)
برای n حلقه از سیم پیچ مولد با هادی دارای k رشتہ سیم
تکلایه‌ای با استفاده از نتایج بند (f).



(الف) مدار معادل کلی سیم پیچ مولد

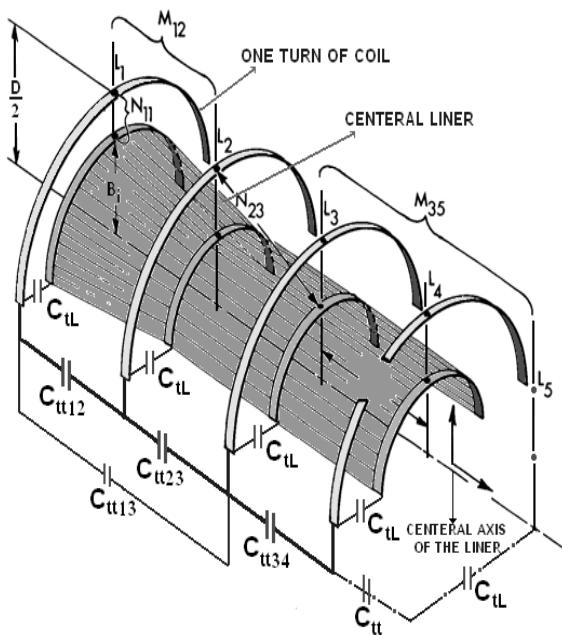


(ب) مدار معادل بسط داده شده و ساده شده RLC سیم پیچ مولد

شکل ۳ مدار معادل سیم پیچ مولد تراکم شار مغناطیسی MCG

شکل (۵) اگرچه مشابه شکل (۴) است، اما برای نمایش ظرفیت‌های خازنی ایجاد شده n حلقه از سیم پیچ مولد به کار رفته که شامل موارد زیر است:

- ظرفیت خازنی حلقه - حلقه (C_{tt}) بین حلقه های سیم پیچ غیر هم جوار.
 - ظرفیت خازنی حلقه - حلقه (C_{tt}) بین حلقه های سیم پیچ هم جوار.
 - ظرفیت خازنی حلقه - هادی استوانه ای تو خالی (C_{tl}).



شکل ۵ طرحی از ظرفیت خازنی پراکندگی کل n حلقه از سیم پیچ مولد که هر حلقه دارای k رشته سیم هادی در درون خود است.

طرحی از سطح مقطع یک حلقه از سیم پیچ یا یک لایه از رشته سیم‌ها که به‌طور یکنواخت پیچیده شده در شکل (۶) نشان داده شده است.

* فرضیهای برای یک حلقه k رشته‌ای مولد

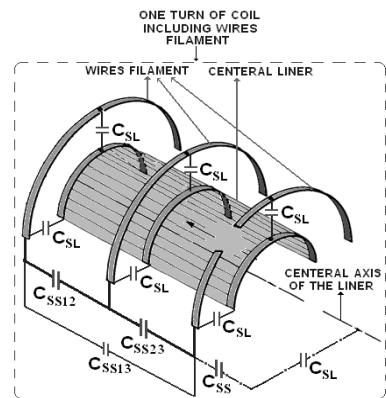
الف) از ظرفیت خازنی بین حلقه‌های ناهمجوار مولد صرف نظر می‌شود.

ب) فاصلهٔ هوايی تمامی رشته سيمهای موجود در درون هر حلقه از سيم پيچ مولد از هادی استوانه‌اي توخالي را مساوی و برابر Z در نظر می‌گيريم. به اين دليل که فاصلهٔ هوايی بين رشته سيمهای هادی و هادی استوانه‌اي توخالي بسیار بزرگتر از قطر سطح مقطع يك حلقه از سيم پيچ است و در نتيجه با خطای بسیار کمی قابل چشم‌پوشی است (شکل ۶).

ج) از اثر نشستی خازنی بین لبه‌های دو رشته سیم هادی و بین لبه‌های رشته سیم هادی و هادی استوانه‌ای توخالی مولد صرف نظر می‌شود.

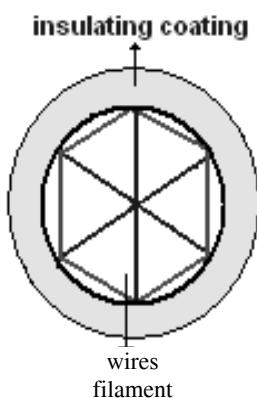
در شکل (۴) ظرفیت خازنی ایجاد شده بین رشته سیم‌های فقط یک حلقه با هادی استوانه توخالی نشان داده شده که شامل موارد زیر است:

- ظرفیت خازنی رشته-رشته (C_{ss}) بین رشته سیم های غیر هم جوار در درون یک حلقه از سیم پیچ.
 - ظرفیت خازنی رشته-رشته (C_{ss}) بین رشته سیم های هم جوار که در یک حلقه از سیم پیچ قرار دارند.
 - ظرفیت خازنی رشته-هادی استوانه ای توانخالی (C_{sl}).

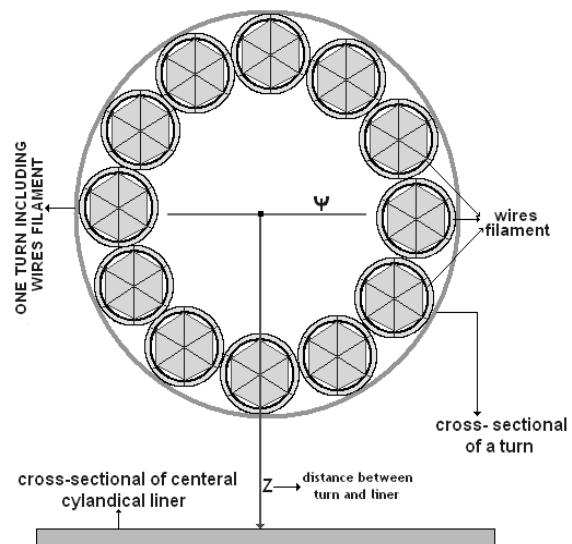


شکل ۴ طرحی از ظرفیت خازنی پراکندگی کل یک حلقه چند رشته‌ای از سیم پیچ مولد تراکم شار مغناطیسی در مقیاس فرضی و غیر واقعی.

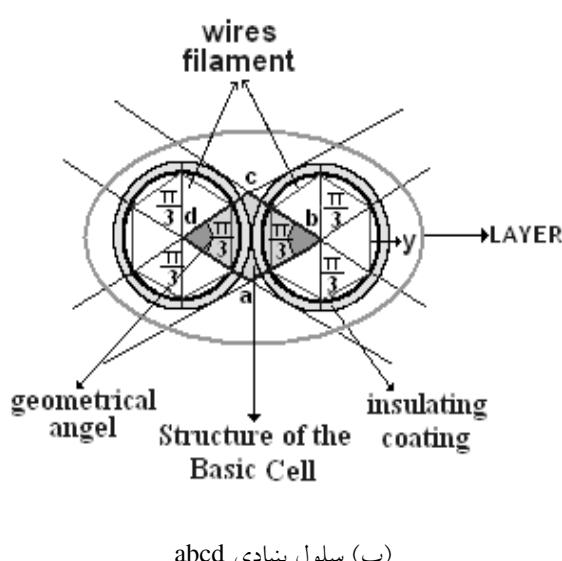
هادی مجاور مماس می‌شود. در این مقاله این ناحیه شش‌ضلعی را که شبکه شش‌ضلعی منتظم و مشابه لانه زنبور است، با عنوان ناحیه شش‌ضلعی منتظم لانه زنبوری^۲ (VRH) نام‌گذاری می‌کیم.



(الف) ناحیه شش‌ضلعی منتظم لانه زنبوری



شکل ۶ طرحی از سطح مقطع شش‌ضلعی منتظم لانه زنبوری یک حلقه از سیم پیچ مولد با k رشتہ سیم هادی تکلایه‌ای در مقیاس فرضی و غیر واقعی



(ب) سلول بنیادی abcd

شکل ۷ سلول بنیادی لوزی متساوی الاضلاع abcd برای محاسبه ظرفیت خازنی رشتہ-رشته

همان‌طور که می‌بینید برای به‌دست آوردن ظرفیت خازنی بین دو رشتہ از یک حلقه از سیم پیچ ابتدا یک ناحیه شش‌ضلعی منتظم با زوایای کاملاً مساوی با زاویه $\frac{2\pi}{3}$ رادیان و اضلاع مساوی و برابر u را در داخل سطح مقطع دایره‌ای شکل هر رشتہ سیم هادی در نظر می‌گیریم، به‌گونه‌ای که مرکز این شش‌ضلعی کاملاً منطبق بر مرکز سطح مقطع دایره‌ای شکل هر رشتہ سیم هادی باشد. اندازه کمان‌های مقابل اضلاع این شش‌ضلعی به‌دلیل تساوی ضلع‌ها کاملاً با هم برابرند. یک سلول بنیادی^۱ لوزی شکل متشکل از دو ناحیه ذوزنقه‌ای (نواحی ۱ و ۲ در شکل ۸) را در نظر می‌گیریم. امتداد اضلاع این لوزی از دو رأس مجاور شش‌ضلعی عبور می‌کند و بر سطوح خارجی رشتہ سیم

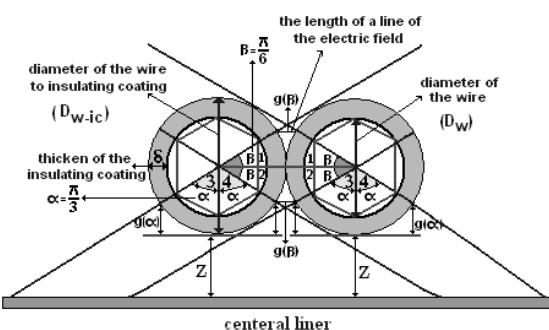
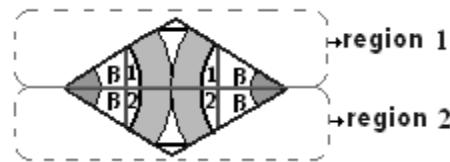
dC بین دو سطح المانی منطبق بر هم این دو رشتہ سیم هادی با مساحت dS که مقابله یکدیگر قرار دارند برابر است با:

$$dC = \epsilon \frac{ds}{g(\beta)} \quad (1)$$

$$\epsilon = \epsilon_0 * \epsilon_r \quad (2)$$

ϵ_r ضریب گذردگی نسبی ماده دی الکتریک و $g(\beta) = 8.85 * 10^{-12} \epsilon_0$ ضریب گذردگی خلا و (β) طول خطوط میدان الکتریکی (گام میدان الکتریکی) بین دو سطح هادی المانی است که مقابله هم هستند. در این مطالعه طول g تابعی از موقعیت دو سطح المانی دو رشتہ سیم هادی از یک حلقه از سیم پیچ مولد با زاویه β بوده و ثابت نیست. بنابراین برای هر سیم هادی مدور رشتہ ای در داخل یک حلقه از سیم پیچ مولد، موقعیت مکانی هر سطح المان می تواند توسط مختصات زاویه β توصیف شود (شکل ۸).

۳- ظرفیت خازنی رشتہ-رشته (C_{ss}) بین دو رشتہ سیم هادی از یک حلقه از سیم پیچ مولد
A- ساختار سلول بنیادی لوزی شکل مدل لانه زنبوری سلول بنیادی لوزی $abcd$ که ظرفیت خازنی رشتہ-رشته (C_{ss}) را تشکیل می دهد در شکل (۷) نشان داده شده است. همان طور که دیده می شود ساختار هندسی شده است. همان طور که در یک لایه سلول بنیادی دو رشتہ سیم هم‌جاوار که در یک لایه قرار دارند با ساختار هندسی سلول بنیادی سایر رشتہ سیم های هم‌جاوار یکسان است. بنابراین ناحیه داخلی سطح مقطع هر حلقه تکلایه از سیم پیچ مولد را می توان به سلول های بنیادی مشابه و یکسان تقسیم

(الف) طرحی از مسیر $(\beta)g(\beta)$ خطوط میدان الکتریکی E با زاویه β 

(ب) دو ناحیه ۱ و ۲ ذوزنقه در داخل سلول بنیادی لوزی

شکل ۸ طرحی از مسیر $(\beta)g(\beta)$ خطوط میدان الکتریکی E با زاویه β بین دو رشتہ سیم هم‌جاوار در درون یک حلقه از سیم پیچ

سلول بنیادی لوزی $abcd$ مربوط به ظرفیت خازنی رشتہ-رشته (C_{ss}) در شکل (۷) نشان داده شده است. در دو شکل (۶) و (۷) می توان به تقارن هندسی رشتہ سیم های هر حلقه از سیم پیچ پس برد. با توجه به این تقارن هندسی رشتہ سیم ها، قسمتی از خطوط میدان الکتریکی E که از یک رشتہ سیم خارج می شود، توسط دو رشتہ سیم هم‌جاوار در اطراف این رشتہ سیم احاطه می شود. با توجه به تقارن هندسی سیم پیچ، خطوط میدان الکتریکی می باید به طور یکسان بین دو رشتہ سیم هادی هم‌جاوار با این رشتہ سیم تقسیم شود. اگر دو رشتہ سیم هادی مجاور نزدیک به هم را در یک حلقه از سیم پیچ MCG در نظر بگیریم، ظرفیت خازنی المانی

اولین رشته سیم و دومین خازن مربوط به فاصله هوا^۱ بین دو رشته سیم مجاور و سومین خازن مربوط به پوشش عایقی دومین رشته سیم هادی است. سطوح رشته سیم‌های هادی با تقریب خوبی هم‌پتانسیل در نظر گرفته می‌شود. همان‌طور که می‌بینیم مسیر خطوط میدان الکتریکی بین دو رشته سیم هادی مجاور در هر حلقه از سیم پیچ به صورت شعاعی است. با تقریب خوبی می‌توان کوتاهترین مسیر ممکن را که موازی با خط متصل کننده دو مرکز دو رشته سیم هادی مدور هم‌جاور باشد به عنوان مسیر خطوط میدان الکتریکی در نظر گرفت. این تقریب برای مقادیر کوچک زاویه β درست بوده و نقش مهمی در تعیین ظرفیت خازنی رشته-رشته دارد. برای مقادیر بزرگ β خطای این تقریب افزایش می‌یابد؛ بدین صورت که مقادیر بزرگ β منجر به افزایش ظرفیت خازنی نسبت به ظرفیت خازنی واقعی می‌شود. به هر حال ظرفیت خازنی رشته-رشته سطوح با افزایش مقادیر β کاهش می‌یابد و همچنین با افزایش مقادیر β ، مقدار خطای ایجاد شده در ظرفیت خازنی قابل اغماض خواهد بود.

B- ظرفیت خازنی پوشش عایقی (C_{ic}) بین دو رشته هادی مجاور در هر حلقه از سیم پیچ مولد در این قسمت، روشهای برای محاسبه ظرفیت خازنی پوشش عایقی در بین دو حلقه رشته سیم هادی هم‌جاور که در درون یک حلقه از سیم پیچ مولد قرار دارند ارائه می‌شود. شکل(۹) سطح المانی استوانه‌ای بین سطح رشته سیم هادی و سطح پوشش عایقی را نشان می‌دهد.

کرد و فقط سلول‌های مجاور به هادی استوانه‌ای توخالی، با سلول رشته-رشته متفاوت خواهد بود. با تقریب ساده اولیه، می‌توانیم تمامی سلول‌های بنیادی را مشابه و یکسان در نظر بگیریم. این سلول‌های بنیادی شامل ناحیه‌ای از محیط پیرامون دو رشته سیم هادی هم‌جاور است که تحت زاویه $\frac{\pi}{3}$ رادیان منطبق شده اند(شکل(۷)). بنابراین به منظور محاسبه ظرفیت خازنی خودی رشته-رشته (C_{ss}) هر حلقه از سیم پیچ مولد، باید از رابطه (۱) در زاویه $\frac{\pi}{3}$ رادیان انگرال گیری کنیم.

این بیان برای رشته سیم‌هایی که به طور کامل توسط رشته سیم‌های هادی مجاور دیگر احاطه شده‌اند به دلیل تقارن هندسی همان‌طور که در شکل‌های (۶)، (۷) و (۸) دیده می‌شود صحیح است. با فرض چشم‌پوشی از اثر خازنی لبه می‌توان زاویه مشابه و یکسان $\frac{\pi}{3}$ رادیان در نظر گرفته شده را برای تمامی رشته سیم‌ها استفاده کرد. برای سلول بنیادی لوزی نشان داده شده در شکل (۷)، سه ناحیه متفاوت توسط خطوط میدان الکتریکی قطع می‌شود که عبارتند از:

- ۱- ناحیه پوشش عایقی رشته سیم هادی اول
- ۲- ناحیه پوشش عایقی رشته سیم هادی دوم
- ۳- ناحیه فاصله هوا^۱ بین دو رشته سیم هادی فوق در هر حلقه از سیم پیچ که در مجاور هم قرار دارند.

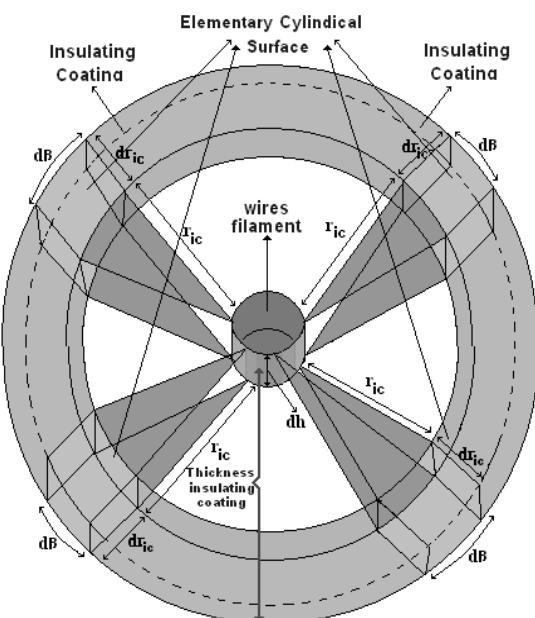
بنابراین ظرفیت المانی C_{ss} بین رشته سیم‌های هادی مجاور در درون هر حلقه از سیم پیچ مولد معادل است با ترکیب سری ظرفیت خازنی سه خازن المانی سه ناحیه فوق. به بیانی دیگر اولین خازن مربوط به پوشش عایقی

ظرفیت خازنی المانی مربوط به این پوشش عایقی استوانه‌ای برابر است با:

$$dC_{ic} = \varepsilon \frac{ds}{g(\beta)} = \varepsilon_0 * \varepsilon_r * \frac{r_{ic} * d\beta * dh}{dr_{ic}} \quad (3)$$

انتگرال‌گیری از این معادله برای دامنه شعاع r از محدوده شعاع رشته سیم هادی بدون پوشش عایقی (r_w) تا شعاع بیرونی رشته سیم همراه با پوشش عایقی (r_{w-ic}) و برای h (همان طول حلقه رشته سیم هادی) از محدوده صفر تا طول حلقه رشته سیم هادی (l_{ts})، ظرفیت خازنی پوشش عایقی محدود به زاویه المانی $d\beta$ را به صورت ذیل به دست می‌دهد:

$$dC_{ic} = \varepsilon_0 * \varepsilon_r * d\beta * \int_0^{l_{ts}} dh \int_{r_w}^{r_{w-ic}} \frac{r_{ic}}{dr_{ic}} \quad (4)$$



(الف)

بنابراین:

$$dC_{ic} = \varepsilon_0 * \varepsilon_r * \frac{l_{ts}}{\ln(\frac{r_{w-ic}}{r_w})} d\beta \quad (5)$$

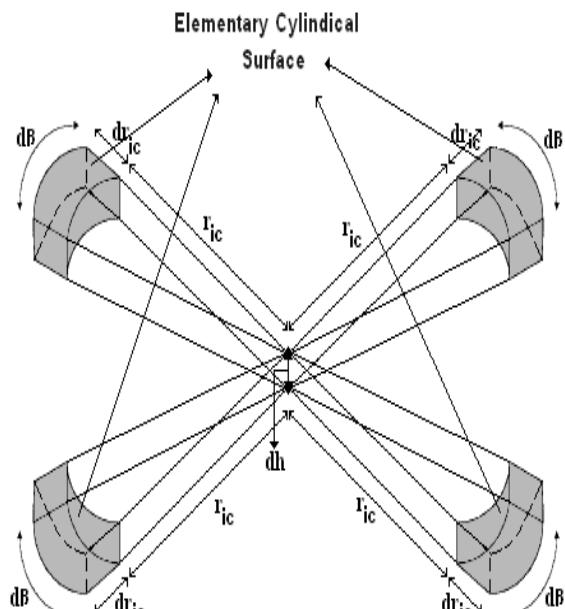
از سوی دیگر دو عایق پوششی دو رشته سیم هادی در درون هر حلقه از سیم‌بیچ مولد به صورت سری با هم قرار دارند، بنابراین ظرفیت خازنی المانی پوشش عایقی سلول بنیادی دو رشته سیم هادی مجاور هم با زاویه β برابر است با:

$$\frac{1}{dC_{ic \rightarrow ss}} = \frac{1}{dC_{ic}} + \frac{1}{dC_{ic}} = \frac{2}{dC_{ic}} \quad (6)$$

$$dC_{ic \rightarrow ss} = \frac{dC_{ic}}{2} \quad (7)$$

بنابراین ظرفیت خازنی المانی پوشش عایقی سلول بنیادی برابر است با:

$$dC_{ic \rightarrow ss} = \varepsilon_0 * \varepsilon_r * \frac{l_{ts}}{2 * \ln(\frac{r_{w-ic}}{r_w})} d\beta \quad (8)$$



(ب)

شکل ۹ سطح مقطع المانی استوانه‌ای در داخل پوشش عایقی در مقیاس فرضی و غیر واقعی

با انتگرال گیری از (۱۴) بر حسب $\frac{\pi}{6} = \beta$ ظرفیت خازنی فاصله هواپی بین دو رشته سیم هادی هم‌جاور در درون هر حلقه از سیم‌پیچ MCG به دست می‌آید:

$$C_{ag \rightarrow ss}(\beta) = \frac{1}{2} * \varepsilon_0 * l_{ts} \int_{\beta=0}^{\beta=\frac{\pi}{6}} \frac{1}{1-\cos(\beta)} d\beta \quad (15)$$

۴- ظرفیت خازنی رشته-رشته (C_{ss}) بین دو رشته سیم هم‌جاور در درون یک حلقه از سیم‌پیچ مولد

از آنجا که ظرفیت خازنی دو ناحیه (۱) و (۲) بین دو رشته سیم هادی هم‌جاور به صورت موازی با هم ترکیب می‌شوند، داریم:

(۱۶)

$$dC_{ss}(\beta) = dC_{ss1}(\beta) + dC_{ss2}(\beta) = 2 * dC_{ss1}(\beta) \quad (16)$$

$dC_{ss1}(\beta)$ ظرفیت خازنی کل ناحیه ۱ و (β) ظرفیت خازنی کل ناحیه ۲ در بین دو رشته سیم هادی است که با توجه به تقاضه هندسی دو ناحیه ۱ و ۲ در شکل (۸)، ظرفیت خازنی این دو ناحیه با هم برابر است. از آنجا که ظرفیت خازنی المانی پوشش عایقی و ظرفیت خازنی المانی فاصله هواپی بین دو رشته سیم هادی هم‌جاور هر یک از دو ناحیه ذوزنقه‌ای (ناحیه ۱ یا ۲) به صورت سری با هم ترکیب می‌شوند، بنابراین ظرفیت خازنی معادل کل بین دو رشته سیم هادی هم‌جاور با توجه به (۱۶) برابر است با:

$$dC_{ss}(\beta) = 2 * [dC_{ss1}(\beta) = \frac{dC_{ic \rightarrow ss} * dC_{ag \rightarrow ss}(\beta)}{dC_{ic \rightarrow ss} + 2C_{ag \rightarrow ss}(\beta)}] \quad (17)$$

در نتیجه ظرفیت خازنی کل رشته-رشته (C_{ss}) دو رشته سیم هم‌جاور در درون هر حلقه از سیم‌پیچ مولد

با انتگرال گیری از رابطه فوق بر حسب β ، ظرفیت خازنی پوشش عایقی دو رشته سیم هادی هم‌جاور در درون یک حلقه از سیم‌پیچ مولد تراکم شار مغناطیسی به دست می‌آید:

$$C_{ic \rightarrow ss}(\beta) = \varepsilon_0 * \varepsilon_r * \frac{l_{ts}}{2 * \ln(\frac{r_w - ic}{r_w})} \beta \quad (9)$$

- ظرفیت خازنی فاصله هواپی (C_{ag}) بین دو رشته هادی هم‌جاور در درون هر حلقه از سیم‌پیچ مولد با توجه به شکل (۷) و (۸) زاویه β برابر است با:

$$\cos(\beta) = 1 - \frac{g(\beta)}{D_{w-ic}} \quad (10)$$

بنابراین طول مسیر میدان الکتریکی که تابعی از زاویه β است برابر است با:

$$g(\beta) = D_{w-ic} * (1 - \cos(\beta)) \quad (11)$$

مساحت سطح المانی رشته سیم هادی که شامل پوشش عایقی و به شکل حلقه المانی و به طول حلقه رشته سیم هادی (l_{ts}) است برابر است با:

$$ds = \frac{1}{2} * l_{ts} * D_{w-ic} d\beta \quad (12)$$

همچنین ظرفیت خازنی بین دو رشته سیم هم‌جاور مربوط به فاصله هواپی در درون هر حلقه برابر است با:

$$dC_{ag} = \varepsilon_0 * \frac{ds}{g(\beta)} \quad (13)$$

در این صورت ظرفیت خازنی کل $dC_{ag \rightarrow ss}$ مربوط به فاصله هواپی بین دو رشته سیم هادی هم‌جاور برابر است با:

$$dC_{ag \rightarrow ss}(\beta) = \varepsilon_0 * \frac{l_{ts} * D_{w-ic}}{2 * g(\beta)} d\beta = \varepsilon_0 * \frac{l_{ts}}{2 * (1 - \cos(\beta))} d\beta \quad (14)$$

یادآوری می‌شود که برای محاسبه ظرفیت خازنی رشته-هادی استوانه‌ای توخالی فقط یک عایق پوششی داریم. بنابراین:

$$dC_{ic \rightarrow sl} = dC_{ic} = \frac{\varepsilon_0 * \varepsilon_r * l_{ts}}{\ln\left(\frac{r_{w-ic}}{r_w}\right)} d\alpha \quad (21)$$

با انتگرال‌گیری از این رابطه داریم:

$$C_{ic \rightarrow sl} = \frac{\varepsilon_0 * \varepsilon_r * l_{ts}}{\ln\left(\frac{r_{w-ic}}{r_w}\right)} * \alpha \quad (22)$$

از سوی دیگر طول مسیر خطوط میدان الکتریکی در فاصله هوایی بین رشته سیم هادی و خط \mathcal{W} فرضی که به‌طور میانگین از وسط حلقه سیم پیچ می‌گذرد برابر Z است. همچنین سلول بنیادی ظرفیت خازنی رشته-هادی استوانه‌ای توخالی نسبت به سلول بنیادی ظرفیت خازنی رشته-رشته وسیع تر و بزرگتر بوده و بخشی از محیط رشته سیم هادی که با تقریب ساده منطبق بر زاویه $\frac{2\pi}{3}$ است، شامل سلول بنیادی رشته-هادی استوانه‌ای توخالی خواهد بود (شکل ۸).

با توجه به شکل‌های (۷) و (۸) زاویه α برابر است با:

$$\cos(\alpha) = 1 - \frac{2g(\alpha)}{D_{w-ic}} \quad (23)$$

بنابراین طول مسیر میدان الکتریکی که تابعی از زاویه α باشد برابر است با:

$$g(\alpha) = \frac{D_{w-ic} * (1 - \cos(\alpha))}{2} \quad (24)$$

مساحت سطح المانی رشته سیم هادی که شامل پوشش عایقی و به شکل حلقه المانی و به‌طول حلقه رشته سیم هادی (l_{ts}) باشد برابر است با:

$$ds = \frac{1}{2} * l_{ts} * D_{w-ic} d\alpha \quad (25)$$

تراکم شار مغناطیسی MCG با در نظر گرفتن اثر پوشش عایقی برابر است با:

$$dC_{ss}(\beta) = \frac{\varepsilon_0 * l_{ts}}{1 - \cos(\beta) + 2 * \ln\left(\frac{D_{w-ic}}{D_w}\right) \varepsilon_r^{-1}} d\beta \quad (18)$$

با انتگرال‌گیری از (۱۸) و جایگزینی پارامترها و با توجه به اینکه کران پایین و بالا زاویه β برابر صفر و $\frac{\pi}{6}$ است، ظرفیت خازنی (C_{ss}) بین دو رشته هادی برابر است با:

$$(19)$$

$$C_{ss}(\beta) = \varepsilon_0 * l_{ts} * \int_0^{\beta} \frac{1}{1 - \cos(\beta) + 2 * \ln(K1) \varepsilon_r^{-1}} d\beta$$

$$(20)$$

$$C_{ss} = \varepsilon_0 * \varepsilon_r * l_{ts} * \left(\frac{\text{Arc tan}(\tan(\frac{\pi}{24}) * \sqrt{K2})}{\sqrt{K3}} \right)$$

$$K1 = \frac{D_{w-ic}}{D_w} \quad \text{که در آن:}$$

$$K2 = \varepsilon_r * (\ln(K1))^{-1} + 1$$

$$K3 = \varepsilon_r * \ln(K1) + (\ln(K1))^2$$

۵- ظرفیت خازنی رشته-هادی استوانه‌ای توخالی (C_{sl}) بین یک رشته سیم درون هر حلقه از سیم پیچ و هادی استوانه‌ای توخالی مولد

برای محاسبه ظرفیت خازنی رشته-هادی استوانه‌ای توخالی (C_{sl}) نخست از رابطه (۵) برای محاسبه ظرفیت پوشش عایقی - که بین رشته سیم هادی و هادی استوانه‌ای توخالی قرار دارد - استفاده می‌کنیم. در اینجا

از آنجا که ظرفیت خازنی بین رشته سیم هادی و هادی استوانه‌ای توخالی دو ناحیه ۳ و ۴ به صورت موازی با هم ترکیب می‌شوند داریم:

(۳۰)

$$dC_{sl}(\alpha) = dC_{sl3}(\alpha) + dC_{sl4}(\alpha) = 2 * dC_{sl3}(\alpha)$$

$dC_{sl4}(\alpha)$ ظرفیت خازنی کل ناحیه ۳ و (α) ظرفیت خازنی کل ناحیه ۴ در بین رشته سیم هادی و هادی استوانه‌ای توخالی است که با توجه به تقارن هندسی دو ناحیه ۳ و ۴ در شکل (۸)، ظرفیت خازنی این دو ناحیه با هم برابر است.

با توجه به ترکیب سری ظرفیت خازنی المانی فاصله هوایی و پوشش عایقی هر یک از دو ناحیه ذوزنقه‌ای (ناحیه ۳ و ۴)، ظرفیت خازنی معادل کل بین یک رشته سیم هادی در درون هر حلقه از سیم پیچ با هادی استوانه‌ای توخالی با توجه به (۳۰) برابر است:

(۳۱)

$$dC_{sl}(\alpha) = 2 * [dC_{sl3}(\alpha)] = \frac{dC_{ag \rightarrow sl} * dC_{ic \rightarrow sl}}{dC_{ic \rightarrow sl} + 2dC_{ag \rightarrow sl}}$$

با جایگزینی پارامترها و با انتگرال‌گیری از (۳۱) و با توجه به اینکه کران بالا و پایین α برابر صفر و $\frac{\pi}{3}$ است داریم:

(۳۲)

$$C_{sl}(\alpha) = K10 * \frac{\text{Arc tan} \left[\frac{K9}{\sqrt{K6+K7+K8}} * \frac{1}{\sqrt{3}} \right]}{\sqrt{K6+K7+K8}}$$

که

$$\begin{aligned} K6 &= \varepsilon_r^2 * Z(D_{w-ic} + Z) \\ K7 &= D_{w-ic} \varepsilon_r (D_{w-ic} + 2Z) \ln[K1] \\ K8 &= D_{w-ic}^2 \ln^2[K1] \\ K9 &= \varepsilon_r (D_{w-ic} + Z) + (D_{w-ic} * \ln(K1)) \\ K10 &= 2 * \varepsilon_0 * \varepsilon_r * l_{ts} * D_{w-ic} \end{aligned}$$

همچنین ظرفیت خازنی خودی بین رشته سیم هادی و هادی استوانه‌ای توخالی مربوط به فاصله هوایی برابر است با:

$$dC_{ag \rightarrow sl} = \varepsilon_0 * \frac{ds}{g(\alpha)+Z} \quad (26)$$

$dC_{ag \rightarrow sl}$ ظرفیت خازنی کل مربوط به ناحیه ۳ فاصله هوایی بین رشته سیم هادی و هادی استوانه‌ای توخالی است. با توجه به توضیحات بالا و روابط (۲۵) و (۲۶) ظرفیت خازنی فاصله هوایی رشته-هادی استوانه‌ای توخالی ناحیه (۳) برابر است با:

$$dC_{ag \rightarrow sl}(\alpha) = \frac{\varepsilon_0 * l_{ts} * D_{w-ic}}{2(g(\alpha)+Z)} d\alpha \quad (27)$$

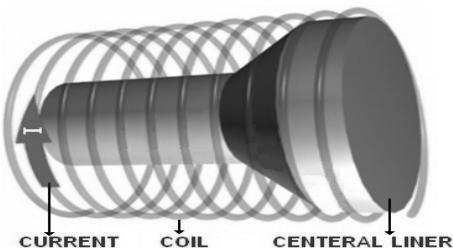
با جایگزینی رابطه (۲۴) در (۲۷) ظرفیت خازنی فاصله هوایی بین رشته و هادی استوانه‌ای توخالی ناحیه ۳ برابر است با:

$$dC_{ag \rightarrow sl}(\alpha) = \frac{\varepsilon_0 * l_{ts} * D_{w-ic}}{D_{w-ic} * (1 - \cos(\alpha)) + 2Z} d\alpha \quad (28)$$

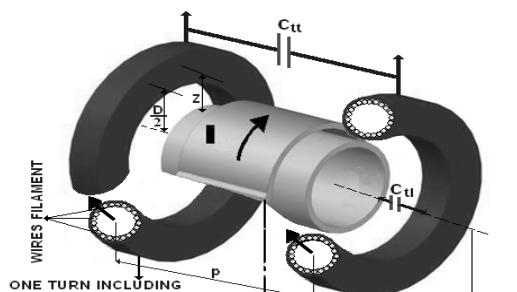
با توجه به شکل‌های (۷) و (۸) و این‌که کران بالا و پایین α به ترتیب برابر صفر و $\frac{\pi}{3}$ است و همچنین با انتگرال‌گیری از (۲۸) در این محدوده، ظرفیت خازنی فاصله هوایی بین هادی استوانه‌ای توخالی و رشته سیم هادی ناحیه ۳ - که درون یک حلقه قرار دارد - برابر است با:

$$C_{ag \rightarrow sl}(\alpha) = \varepsilon_0 * l_{ts} * D_{w-ic} * \frac{\text{Arc tan} \left[\sqrt{\frac{(D_{w-ic}+Z)}{3*Z}} \right]}{Z * \sqrt{1 + \frac{D_{w-ic}}{Z}}} \quad (29)$$

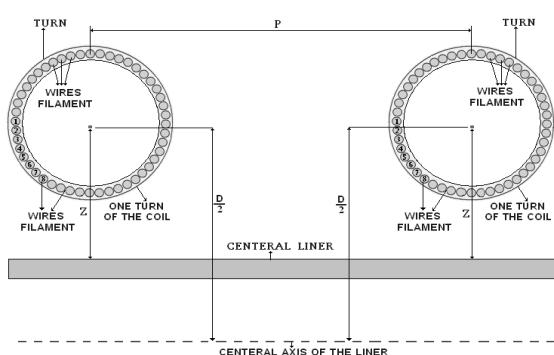
(فاصله بین مراکز دو رشته سیم همچوار) حلقه های سیم پیچ مولد است.



شکل ۱۰ شکل واقعی هادی استوانه ای توخالی و حلقه های دارای K رشته سیم هادی با سطح مقطع دایره ای MCG



الف) دو حلقه مجاور که K رشته سیم هادی با سطح مقطع دایره ای دارند.



سطح مقطع دو حلقه مجاور که K رشته سیم هادی با سطح مقطع دایره ای دارند.

شکل ۱۱ سطح مقطع دایره ای شکل حلقه ها همراه با هادی استوانه ای توخالی در مرکز سیم پیچ MCG

۶- محاسبه ظرفیت خازنی حلقه - حلقه (C_{tt}) مولد

سطح مقطع رشته سیم های هادی در هر حلقه را می توان دایره ای در نظر گرفت که به صورت یکواخت بر روی هادی استوانه ای توخالی پیچیده شده است (شکل های (۱۰)، (۱۱)).

به منظور تحلیل ظرفیت خازنی بین دو حلقه از سیم پیچ مولد، نخست باید ظرفیت خازنی رشته حلقه - رشته حلقه (C_{stst}) بین دو رشته سیم هادی از دو حلقه همچوار را به دست آوریم. از سویی می توانیم ظرفیت خازنی بین دو رشته سیم از دو حلقه همچوار را با ظرفیت خازنی واحد طول دو هادی موازی مستقیم به طول بینهایت واقع در ماده همگن که از خمیدگی و انحنای حلقه ها چشم پوشی شده معادل سازی کنیم.

با در نظر گرفتن فرضهای ساده قبلی و با توجه به این که اگر ضخامت t پوشش عایقی رشته سیم هادی در درون هر حلقه از سیم پیچ مولد در مقایسه با فاصله هوایی (فاصله بین مراکز دو رشته سیم از دو حلقه همچوار) (p-2r_w-ic) کوچک باشد، می توانیم روشی تحلیلی را برای محاسبه ظرفیت خازنی رشته حلقه - رشته حلقه (C_{stst}) برای رشته سیم هایی با سطح مقطع دایره ای ارائه کنیم [۱۲].

با توجه به اینکه تنها عامل ایجاد کننده ظرفیت خازنی بین دو رشته سیم هادی بدون پوشش عایقی از دو حلقه همچوار، فاصله هوایی بین دو رشته سیم هادی است، بنابراین برای ظرفیت خازنی رشته حلقه - رشته حلقه (C_{stst}) بین دو رشته سیم هادی بدون پوشش عایقی از دو حلقه همچوار مولد داریم:

$$C_{stst} = \frac{\epsilon_0 \cdot \pi^2 \cdot D}{\ln\left(\frac{p}{D_w} + \sqrt{\left(\frac{p}{D_w}\right)^2 - 1}\right)} \quad (33)$$

D قطر داخلی حلقه رشته سیم، D_w قطر سطح مقطع دایره ای رشته سیم هادی و P گام سیم پیچی

در نتیجه با جایگذاری روابط (۳۴) و (۳۵) در (۳۷) برای محاسبه ظرفیت خازنی بین دو رشته سیم هادی از دو حلقه همچوار و با فرض این که پوشش عایقی (t) دارای ضریب دیالکتریک ϵ_r و میدان الکتریکی در پوشش عایقی (t) به صورت شعاعی باشد، داریم:

$$C_{stst} = \frac{\pi^2 * \epsilon_0 * D}{\ln \left[A + \sqrt{[A]^2 - \left(\frac{D_{w-ic}}{D_w} \right)^{2 * \epsilon_r^{-1}}} \right]} \quad (38)$$

که در آن:

$$A = \frac{p}{D_w * \left(1 - \frac{2t}{D_w} \right)^{1 - \epsilon_r^{-1}}}$$

از آنجا که هر حلقه دارای K رشته سیم هادی در درون خود است و با فرض اینکه فاصله هر رشته سیم هادی در درون حلقه اولی با تمامی رشته سیم های درون حلقه دومی یکسان و برابر p (گام سیم پیچی) باشد، بنابر اصل جمع آثار در بین دو حلقه همچوار به تعداد K^2 ظرفیت خازنی رشته حلقه - رشته حلقه (C_{stst}) وجود دارد. با توجه به ترکیب سری ظرفیت های خازنی رشته حلقه - رشته حلقه (C_{stst}) مربوط به K رشته سیم هادی دو حلقه همچوار، ظرفیت خازنی کل بین دو حلقه همچوار ناشی از K رشته سیم هادی برابر است با:

$$\frac{1}{C_{tt}} = \frac{1}{C_{stst}} + \frac{1}{C_{stst}} + \dots + \frac{1}{C_{stst}} = \frac{K^2}{C_{stst}} \quad (39)$$

در نتیجه داریم:

$$C_{tt} = \frac{C_{stst}}{K^2} = \frac{\pi^2 * \epsilon_0 * D}{K^2 * \ln \left[\left| \frac{p}{Q} \right| + \sqrt{\left| \frac{p}{Q} \right|^2 - \left(\frac{D_{w-ic}}{D_w} \right)^{2 * \epsilon_r^{-1}}} \right]} \quad (40)$$

که در آن:

$$Q = D_w * \left(1 - \frac{2t}{D_w} \right)^{1 - \epsilon_r^{-1}}$$

و C_{tt} ظرفیت خازنی بین دو حلقه همچوار است.

به منظور به دست آوردن رابطه ای مناسب برای محاسبه ظرفیت خازنی پراکندگی معادل شبکه سیم پیچ مولد، نخست ظرفیت خازنی مرتبط با پوشش عایقی و ظرفیت خازنی مرتبط با فاصله هوا بین رشته سیم های هادی را به صورت ترکیب سری در مدار معادل در نظر می گیریم. با استفاده از رابطه ظرفیت خازنی مدل استوانه ای، ظرفیت خازنی (C_{ic}) بین دو رشته سیم هادی مرتبط با پوشش عایقی برابر است با:

$$C_{ic} = \frac{2 * \pi * \epsilon_r}{\ln \left(1 + \frac{2t}{D_w} \right)} \quad (34)$$

و برای ظرفیت خازنی C_{ag} مرتبط با فاصله هوا بی:

$$C_{ag} = \frac{\pi * \epsilon_0}{\ln \left[\left(\frac{p}{D_{w-ic}} + \sqrt{\left(\frac{p}{D_{w-ic}} \right)^2 - 1} \right) \right]} \quad (35)$$

مجموع قطر سیم و پوشش عایقی، D_w قطر سطح مقطع دایره ای رشته سیم هادی و P گام سیم پیچی (فاصله بین مرکز دو رشته سیم همچوار) حلقه های سیم پیچ مولد است.

همچنین به دلیل وجود دو پوشش عایقی مربوط به دو رشته سیم هادی از دو حلقه همچوار که به صورت سری ترکیب می شوند، داریم:

$$C_{ic \rightarrow stst} = \frac{C_{ic}}{2} = \frac{\pi * \epsilon_r}{\ln \left(1 + \frac{2t}{D_w} \right)} \quad (36)$$

مجموع ظرفیت خازنی مربوط به دو پوشش عایقی دو رشته سیم هادی از دو حلقه همچوار سیم پیچ مولد است. بنابراین ظرفیت خازنی معادل ترکیب سری فاصله هوا بی و پوشش عایقی این دو رشته سیم هادی از دو حلقه همچوار سیم پیچ مولد برابر است با:

$$C_{stst} = \frac{C_{ic \rightarrow stst} * C_{ag}}{C_{ic \rightarrow stst} + C_{ag}} = \frac{C_{ic} * C_{ag}}{C_{ic} + 2C_{ag}} \quad (37)$$

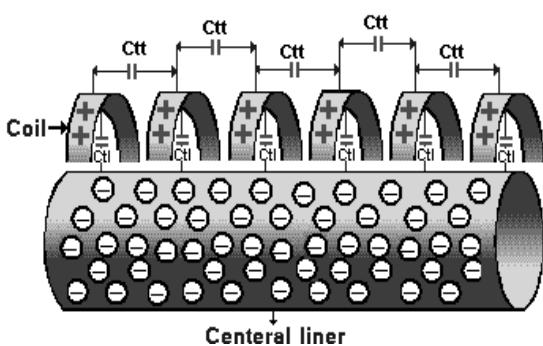
ظرفیت خازنی بین دو رشته سیم هادی از دو حلقه همچوار است.

خازنی حلقه- هادی استوانه‌ای توخالی (C_{tl}) مطابق شکل (۱۲) ظرفیت خازنی پراکنده‌گی کل n حلقه هم‌جوار تکلایه از سیم‌پیچ مولد MCG را - که هر حلقه دارای K رشتہ سیم هادی در درون خود است - محاسبه می‌کنیم [۱۶].

شبکه‌ای متشكل از خازن‌های متتمرکز مطابق شکل (۱۳) می‌تواند ظرفیت خازنی پراکنده‌گی کل (حلقه-حلقه به علاوه حلقه- هادی استوانه‌ای توخالی) را توصیف کند. بنابراین مدار معادل به صورت یک شبکه خازنی پراکنده‌گی کل ($C(n)$ در نظر گرفته می‌شود [۱۸].

شبکه‌ای از خازن‌های متتمرکز برای n حلقه، هر حلقه دارای K رشتہ سیم هادی تکلایه که به دور هادی استوانه‌ای توخالی پیچیده شده، در شکل (۱۲) نشان داده شده است و برای n حلقه، شبکه خازنی نشان داده شده در شکل (۱۳) باید حل شود.

هادی استوانه‌ای توخالی می‌تواند به صورت یک گره در نظر گرفته شود که ظرفیت خازنی حلقه- هادی استوانه‌ای توخالی (C_{tl}) متصل به این گره است.



شکل ۱۲ طرحی از فضای هندسی n حلقه‌دارای K رشتہ سیم هادی تکلایه و هادی استوانه‌ای توخالی در مرکز حلقه‌های سیم‌پیچ و ظرفیت خازنی پراکنده‌گی حلقه- حلقه (C_{tt}) و ظرفیت خازنی پراکنده‌گی حلقه- هادی استوانه‌ای توخالی (C_{tl}) در مقیاس فرضی و غیر واقعی

۷- ظرفیت خازنی پراکنده (C_{tl}) بین یک حلقه دارای K رشتہ سیم با هادی استوانه‌ای توخالی مولد

می‌توان ظرفیت خازنی بین یک حلقه دارای K رشتہ سیم هادی و هادی استوانه‌ای توخالی مرکزی مولد را با صرف نظر کردن از انحنا و خمیدگی رشتہ سیم‌های هادی به دست آورد. با توجه به مطالب قبلی و با در نظر گرفتن فرضیهای ساده کننده قبلی و این‌که اگر ضخامت پوشش عایقی (t) رشتہ سیم‌های هادی در مقایسه با فاصله هوایی (Z) کوچک باشد، می‌توانیم ظرفیت خازنی بین رشتہ سیم هادی و هادی استوانه‌ای توخالی (C_{sl}) را برای سیم‌هایی با سطح مقطع دایره‌ای با پوشش عایقی مولد با توجه به (۳۲) بدست آوریم. از طرفی با توجه به اینکه هر حلقه دارای K رشتہ سیم تکلایه در درون خود است و همچنین با توجه به ترکیب موازی ظرفیت‌های خازنی رشتہ- هادی استوانه‌ای توخالی (C_{sl} ، K رشتہ سیم، مقدار ظرفیت خازنی کل هر حلقه ناشی از ظرفیت خازنی رشتہ- هادی استوانه‌ای توخالی K رشتہ سیم برابر است با:

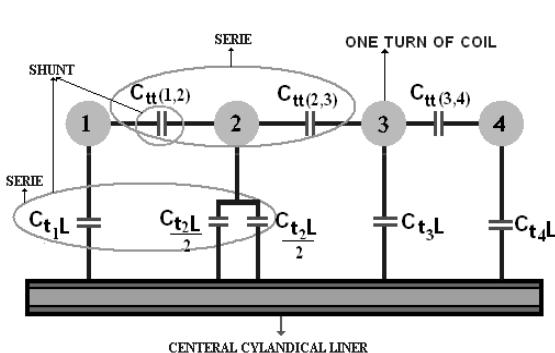
$$C_{tl} = C_{sl} + C_{sl} + \dots + C_{sl} = KC_{sl} \quad (41)$$

ظرفیت خازنی بین حلقه و هادی استوانه‌ای توخالی است. در نتیجه داریم:

$$C_{tl} = (K) * K10 * \frac{\text{Arctan}\left[\frac{K9}{\sqrt{K6+K7+K8}} * \frac{1}{\sqrt{3}}\right]}{\sqrt{K6+K7+K8}} \quad (42)$$

۸- ظرفیت خازنی پراکنده کل مولد تراکم شار مغناطیسی

به منظور به دست آوردن ظرفیت خازنی پراکنده‌گی کل سیم‌پیچ مولد، همان‌طور که در شکل (۲) نشان داده شده، نخست با استفاده از مقادیر ظرفیت خازنی حلقه- حلقه (C_{tt}) و ظرفیت



شکل ۱۴ ظرفیت خازنی بین رشته سیم‌های هادی در حلقه پیچیده شده به دور هادی استوانه‌ای توخالی واقع در مرکز سیم‌پیچ

در نتیجه داریم:

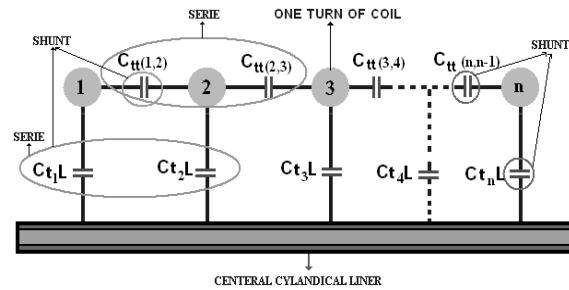
$$C(n=3) = C(1,2,3) = \frac{C_{tt}}{2} + \frac{C_{tl}}{2} \quad (44)$$

به منظور به دست آوردن ظرفیت خازنی کل چهار حلقه متتشکل از K رشته سیم هادی در درون حلقه‌ها، می‌توانیم یک حلقه دیگر را در کنار سه حلقه در نظر بگیریم. بنابراین ظرفیت خازنی کل برابر است با ظرفیت خازنی چیدمان قبلی (دو حلقه) که به‌طور سری با ظرفیت خازنی حلقه به حلقه و به‌طور موازی با ترکیب سری ظرفیت خازنی حلقه-هادی استوانه‌ای توخالی قرار دارد.

بنابراین برای $n=4$ داریم:

$$(n=4) = C(1,2,3,4) = \frac{C_{tt}*C(2)}{C_{tt}+2*C(2)} + \frac{C_{tl}}{2} \quad (45)$$

به منظور به دست آوردن ظرفیت خازنی کل n حلقه می‌توانیم در هر بار یک حلقه را در کنار حلقه‌های قبلی اضافه کنیم که در این صورت به این روش می‌توان ظرفیت خازنی پراکنده‌گی کل سیم‌پیچ مولد تراکم شار مغناطیسی MCG با هر تعداد حلقه را محاسبه کرد.



شکل ۱۳ ظرفیت خازنی متمرکز n حلقه تکلایه از سیم‌پیچ مولد MCG در مقیاس فرضی و غیر واقعی

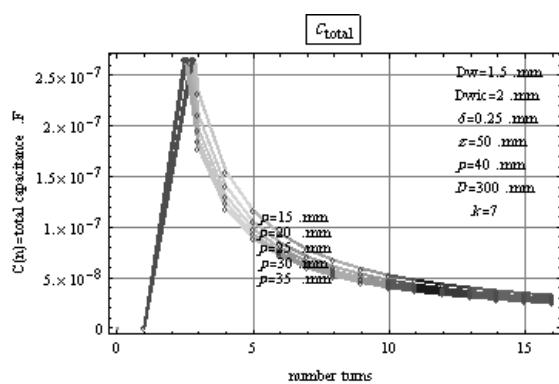
برای n حلقه از سیم‌پیچ مولد که هر حلقه متتشکل از تعداد زیادی رشته سیم هادی در درون خود است، نخست دو حلقه هم‌جوار را از میان حلقه‌های سیم‌پیچ مولد در نظر می‌گیریم. برای این دو حلقه (n=2)، ظرفیت خازنی شبکه، متتشکل از ظرفیت خازنی (C_{tt}) بین دو حلقه ۱ و ۲ که به‌طور موازی با ترکیب سری ظرفیت‌های خازنی حلقه-هادی استوانه‌ای توخالی قرار دارد.

$C_{t(2)l} = C_{t(1)l} = C_{tl}$ و $C_{t(2)l} + C_{t(1)l}$ به ترتیب ظرفیت خازنی حلقه‌های ۱ و ۲ با هادی استوانه توخالی استوانه‌ای مرکزی است. بنابراین ظرفیت خازنی معادل با این دو حلقه هم‌جوار برابر است با:

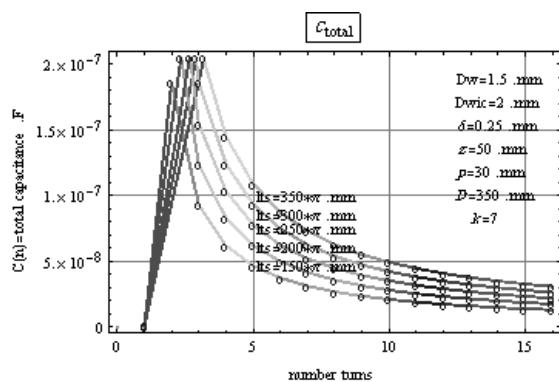
$$C(n=2) = C(1,2) = C_{tt} + \frac{C_{tl}}{2} \quad (43)$$

برای تعداد بیشتر حلقه‌ها، نخست سه حلقه هم‌جوار را از میان سیم‌پیچ مولد مورد نظر در نظر می‌گیریم. ظرفیت خازنی معادل این شبکه خازنی با سه حلقه (n=3) را می‌توان با تقسیم ظرفیت خازنی ($C_{t(2)l}$) به دو قسمت مساوی و استفاده از تبدیل اتصال مثلث به ستاره (Δ/Y) به دست آورد (شکل (۱۴)).

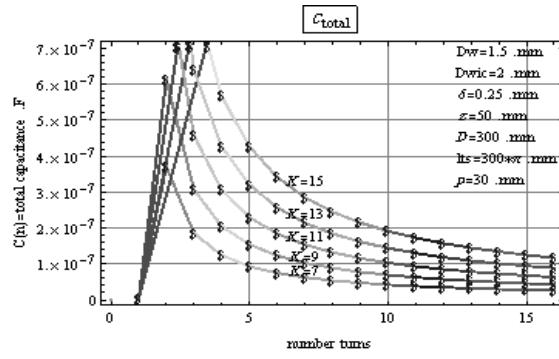
مقطع مؤثر بین حلقه و هادی استوانه‌ای توخالی کاهش می‌یابد و در نهایت ظرفیت خازنی بین حلقه و هادی استوانه‌ای توخالی کاهش خواهد یافت.



شکل ۱۵ ظرفیت خازنی کل MCG برای مقادیر مختلف گام سیم‌پیچی



شکل ۱۶ ظرفیت خازنی کل n حلقه از سیم‌پیچ MCG برای مقادیر مختلف طول حلقه رشتہ سیم هادی



شکل ۱۷ ظرفیت خازنی کل n حلقه از سیم‌پیچ MCG برای مقادیر مختلف تعداد رشتہ سیم‌های هادی

بنابراین برای سیم‌پیچ مولد متشکل از n حلقه تکلایه که هر حلقه دارای K رشتہ سیم هادی در درون خود باشد داریم:

$$C(n) = \frac{C_{tt} * C(n-2)}{C_{tt} + 2 * C(n-2)} + \frac{C_{tl}}{2} \quad (47)$$

$C(n-2)$ ظرفیت خازنی پراکنده (n-2) حلقه از سیم‌پیچ مولد MCG متشکل از K رشتہ سیم هادی است. که n تعداد کل حلقه‌های موجود در سیم‌پیچ مولد مورد نظر است.

۹- نتایج شبیه‌سازی

با توجه به شکل‌های (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) حاصل از شبیه‌سازی ظرفیت خازنی کل C(n) مولد تراکم شار مغناطیسی مشاهده می‌شود که با پیشروی انفجار و گسترش هادی استوانه‌ای توخالی و کاهش تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ مولد، ظرفیت خازنی کل مولد در حین کاهش تعداد حلقه‌ها، افزایش می‌یابد. این افزایش ظرفیت خازنی تا هنگامی که تعداد حلقه‌های موجود در مدار به دو حلقه کاهش یابد ادامه خواهد یافت اما مشاهده می‌شود که هنگامی که فقط یک حلقه در مدار باقی می‌ماند، کاهش نزولی در ظرفیت خازنی کل مولد رخ می‌دهد که علت آن باقی ماندن فقط یک حلقه در مدار است؛ زیرا فقط ظرفیت خازنی حلقه-هادی استوانه‌ای توخالی حضور دارد. با توجه به نتایج شبیه‌سازی می‌توان گفت که این کاهش نزولی شدید در مقدار ظرفیت خازنی کل پراکنده در حلقه اول، این نکته مهم را بیان می‌کند که ظرفیت خازنی ناشی از ظرفیت خازنی حلقه-هادی استوانه‌ای توخالی، آثار تحمیلی بیشتری را بر نتایج حاصل اعمال می‌کند و در این حالت پارامتر گام سیم‌پیچی (p) دیگر اثری نخواهد داشت. مهمترین دلیل این کاهش نزولی، آن است که در حلقه انتهایی با پیشروی انفجار، طول حلقه کاهش یافته و در نتیجه سطح

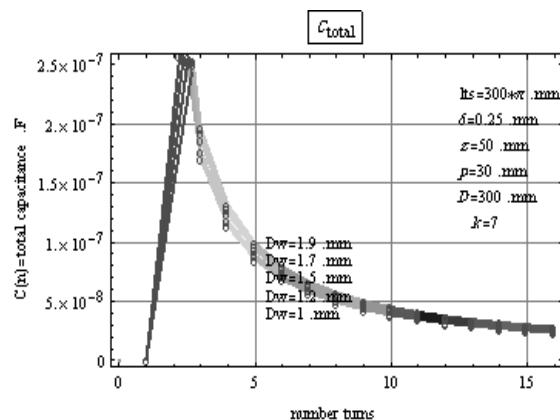
حلقه k رشته‌ای دو لایه نسبت به حلقة k رشته‌ای تکلایه دارای ظرفیت خازنی پراکندگی بیشتری است. از سویی حلقة k رشته‌ای دو لایه نسبت به حلقة k رشته‌ای تکلایه در فرکانس‌های بالا دارای مقاومت اهمی بیشتری است. بنابراین استفاده از حلقه‌های k رشته‌ای دو لایه برای طراحی القاگرهای مولد در فرکانس‌های بسیار بالا مناسب به نظر نمی‌رسد، از سوی دیگر ظرفیت خازنی پراکندگی حلقه‌های k رشته‌ای سه لایه کاهش می‌یابد. اما حل شبکه خازنی مرکز حلقه‌ها با سه لایه بسیار دشوار و پیچیده است. و از سوی دیگر اثر همسایگی حلقه‌ها با افزایش تعداد لایه‌ها افزایش می‌یابد.

بنابراین با توجه به دلایل بالا از سیم‌پیچ‌های دارای سطح مقطع تکلایه باید در فرکانس‌های بسیار بالا، در مولدهای تراکم شار مغناطیسی استفاده شود.

۱۰- نتیجه‌گیری

در این مقاله ظرفیت خازنی پراکندگی سیم‌پیچ مولد MCG دارای K رشته سیم‌های هادی تکلایه از دو مدار معادل ساده شده با پارامترهای بسط داده شده به دست آمده. مدل نهایی شامل مقاومت سری شده با اندوکتانس معادل هر حلقه و موازی با ظرفیت خازنی بین حلقه‌های هم‌جوار است.

در این مقاله روشی به نام مدل شش ضلعی منتظم لانه زنپوری برای محاسبه ظرفیت خازنی پراکندگی بین رشته سیم‌های هادی تکلایه در درون هر حلقه و در نهایت در بین حلقه‌های سیم‌پیچ و نیز بین حلقه و هادی استوانه‌ای توالی مولد تراکم شار مغناطیسی ارائه شد. این روش برای محاسبه ظرفیت خازنی پراکندگی سیم‌پیچ‌های دارای یکلایه رشته سیم‌های هادی مناسب است. مشاهده شد که در این مدل ساده، تعداد رشته سیم‌های هادی و قطر رشته سیم‌های هادی موجود در درون هر حلقه از سیم‌پیچ مولد



شکل ۱۸ ظرفیت خازنی کل n حلقه از سیم‌پیچ MCG برای مقادیر مختلف قطر سطح مقطع رشته سیم‌های هادی

از سویی با توجه به شبیه‌سازی‌های شکل‌های (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) ملاحظه می‌شود که با افزایش طول حلقه (l_{ts}) رشته سیم‌های هادی در درون حلقه‌های سیم‌پیچ و با افزایش قطر سطح مقطع رشته سیم‌های هادی درون حلقه‌های سیم‌پیچ (D_w) و همچنین با کاهش گام سیم‌پیچی حلقه‌های سیم‌پیچ (P) و نیز با افزایش تعداد رشته سیم‌های موجود در درون حلقه‌های سیم‌پیچ (K ، ظرفیت خازنی پراکندگی کل n حلقه از سیم‌پیچ تکلایه مولد افزایش می‌یابد. بنابراین کاهش ظرفیت خازنی پراکندگی کل n حلقه تکلایه از سیم‌پیچ مولد باید تا جایی که امکان دارد:

- ۱- تعداد رشته سیم‌های هادی درون حلقه‌ها را کاهش داد.
- ۲- طول حلقه رشته سیم‌های هادی درون حلقه‌ها را کاهش داد.
- ۳- گام سیم‌پیچی حلقه‌های سیم‌پیچ را کاهش داد.
- ۴- قطر سطح مقطع رشته سیم‌های هادی درون حلقه‌های سیم‌پیچ را افزایش داد.
- ۵- از سیم‌پیچ‌هایی با سطح مقطع تکلایه به جای چند لایه استفاده کرد.

۱۱- منابع

- [1] Andreas, A. Neuber, "Explosively Driven Pulsed Power Helical Magnetic Flux Compression Generators," 1nd ed. vol. 1, New York: Springer-Verlag, 2005.
- [2] Larry L. Altgilbers, Mark D.J. Brown, and Bucur M.Novac, "Magnetocumulative generators," 1nd ed. vol. 1, New York, USA: Springer-Verlag, 2000.
- [3] G. Grandi, "Stray capacitances of single-layer air-core inductors for high-frequency applications," IEEE, pp.1384 - 1388, 9/1996.
- [4] Qin Yu and Thomas W. Holmes, "A Study on stray capacitance modeling of inductors by using the Finite Element method," IEEE, pp.88-93, 2001.
- [5] Antonio Massarini, "Self-capacitance of inductors," IEEE Trans. Power Electronics, vol. 12, no. 4, July 1997.
- [6] Qin Yu, "RF Equivalent circuit modeling of ferrite-core inductors and characterization of core materials," IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility, vol.44, no.1, Feb. 2002.
- [7] W.T. Duerdorff, "Equivalent capacitances of transformer winding," Wireless Engr., 23, p.161, 1946.

و نوع پوشش عایقی و ضخامت پوشش عایقی رشتہ سیم‌ها، طول حلقه رشتہ سیم‌های هادی و گام سیم‌پیچی در ظرفیت خازنی پراکنده کل مولد تأثیر می‌گذارد. همچنین برای کاهش ظرفیت خازنی پراکنده کل مولد باید شعاع سطح مقطع دایره‌ای حلقه‌های سیم‌پیچ، قطر حلقه‌های سیم‌پیچ و تعداد رشتہ سیم‌های هادی درون حلقه‌های سیم‌پیچ کاهش یافته و همچنین فاصله هوا بین حلقه‌های سیم‌پیچ و هادی استوانه‌ای توخالی، گام سیم‌پیچی و ضخامت پوشش عایقی حلقه‌های سیم‌پیچ افزایش یابد.

از سوی دیگر به این نتیجه رسیدیم که برای کاهش ظرفیت خازنی پراکنده کل مولد باید از حلقه‌هایی با سطح مقطع تکلا یه استفاده شود.

ملاحظه شد که با پیشروی انفجار و گسترش حجمی هادی استوانه‌ای توخالی و کاهش تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ مولد، ظرفیت خازنی کل مولد در حین کاهش تعداد حلقه‌ها، افزایش می‌یابد. اما همان‌طور که از شبیه‌سازی پیدا است هنگامی که فقط یک حلقه در مدار باقی می‌ماند، کاهش نزولی مقدار ظرفیت خازنی کل مولد رخ می‌دهد که علت آن، باقی ماندن فقط یک حلقه در مدار است. زیرا فقط ظرفیت خازنی حلقه‌هادی استوانه‌ای توخالی حضور دارد و نیز ظرفیت خازنی ناشی از ظرفیت خازنی حلقه-هادی استوانه‌ای توخالی، آثار تحمیلی بیشتری را بر نتایج حاصل اعمال می‌کند همچنین در حلقه انتهایی با پیشروی انفجار، طول حلقه کاهش یافته و در نتیجه سطح مقطع مؤثر بین حلقه و هادی استوانه‌ای توخالی کاهش می‌یابد و در نهایت ظرفیت خازنی بین حلقه و هادی استوانه‌ای توخالی کاهش خواهد یافت.

- IEEE Industry Applications Conf. Denver, Co, pp.1225-1232. 1994.
- [16] E. C. Snelling, "Soft Ferrites, Properties and Applications," London, U.K.: ILIFFE Books, 1969.
- [17] L. Dalessandro, F. Cavalcante, and J. W. Kolar, "Calculation of the Stray Capacitance of High-Voltage Transformers," ETH Zurich, Zurich, Switzerland, Int. Rep. 03/04, Mar. 2004.
- [18] M. Kostenko and L. Piotrovsky, "Electrical Machines," vol. 1. Moscow, Russia. Mir, 1968.
- [19] L .Dalessandro, F. Silveira, and J. W. Kolar, "Self-Capacitance of High-Voltage Transformers," IEEE Trans. on Power Electronics, vol.22, no. 5, 2007.
- [8] R. G. Medhurst, "H.F. resistance and self-capacitance of single-layer solenoids," Wireless Engr., vol. 24, pp 35, 1947.
- [9] P. L. Dowell, "Effects of eddy currents in transformer windings," Proc. IEE, vol.113, no.8, pp.1287-1394, Aug. 1966.
- [10] N. R. Grossner, "Transformers for Electronic Circuits," Second Edition, McGraw-Hill: New York, 1983.
- [11] A. Massarini, M. K. Kazimierczuk, and G. Grandi, "Lumped parameter models for single and multiple-layer inductors," Proc. Power Electronics, Specialist Conf., Baveno, June 1996.
- [12] A. AZaky, and R. Hawley, "Fundamentals of Electromagnetic Field Theory," Harrape Co Ltd. : London,1947.
- [13] Hai Lu, "Experimental determination of stray capacitances in high frequency transformers," IEEE Trans. Power Electronics, vol. 18, no.5, Sep. 2003.
- [14] R. Chen, J. D. Van Wyk, S. Wang, and W. G. Odendaal, "Application of structural winding capacitance cancellation for integrated EMI filters by embedding conductive layers," in Proc. Ind. Appl. Soc., pp.2679–2686, 2004.
- [15] M .Bartoli , A. Reatti , and M. K . Kazimierczuk , "Modeling of iron powder inductors at high frequencies," in Proc.